

CM1112-FAE 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能

| | | |
|-----------|---------|------------|
| • 过充电保护电压 | 4.425 V | 精度 ±25 mV |
| • 过充电迟滞电压 | 4.225 V | 精度 ±45 mV |
| • 过放电保护电压 | 2.500 V | 精度 ±50 mV |
| • 过放电迟滞电压 | 3.000 V | 精度 ±100 mV |

2) 放电过电流保护功能

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| • 过电流保护电压 | 0.150 V | 精度 ±10 mV |
| • 短路保护电压 | 0.500 V | 精度 ±60 mV |

3) 充电过流保护电压

| | |
|----------|-----------|
| -0.150 V | 精度 ±10 mV |
|----------|-----------|

4) 负载检测功能

5) 充电器检测功能

6) 向 0V 电池充电的功能

允许

7) 休眠功能

无

8) 可选择放电过流状态的解除电压

V_{DIOV}

9) 低电流消耗

| | |
|-------|---|
| • 工作时 | 1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$) |
| • 过放时 | 0.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$) |

10) RoHS、无铅、无卤素

11) 内置低导通内阻 N-MOSFET

- $V_{DS} = 15V$
- ESD Rating: 2000V HBM

■ 应用领域

- 智能穿戴设备
- 蓝牙耳机

■ 封装

- DFN 2.2×2.9-6L

■ 系统功能框图

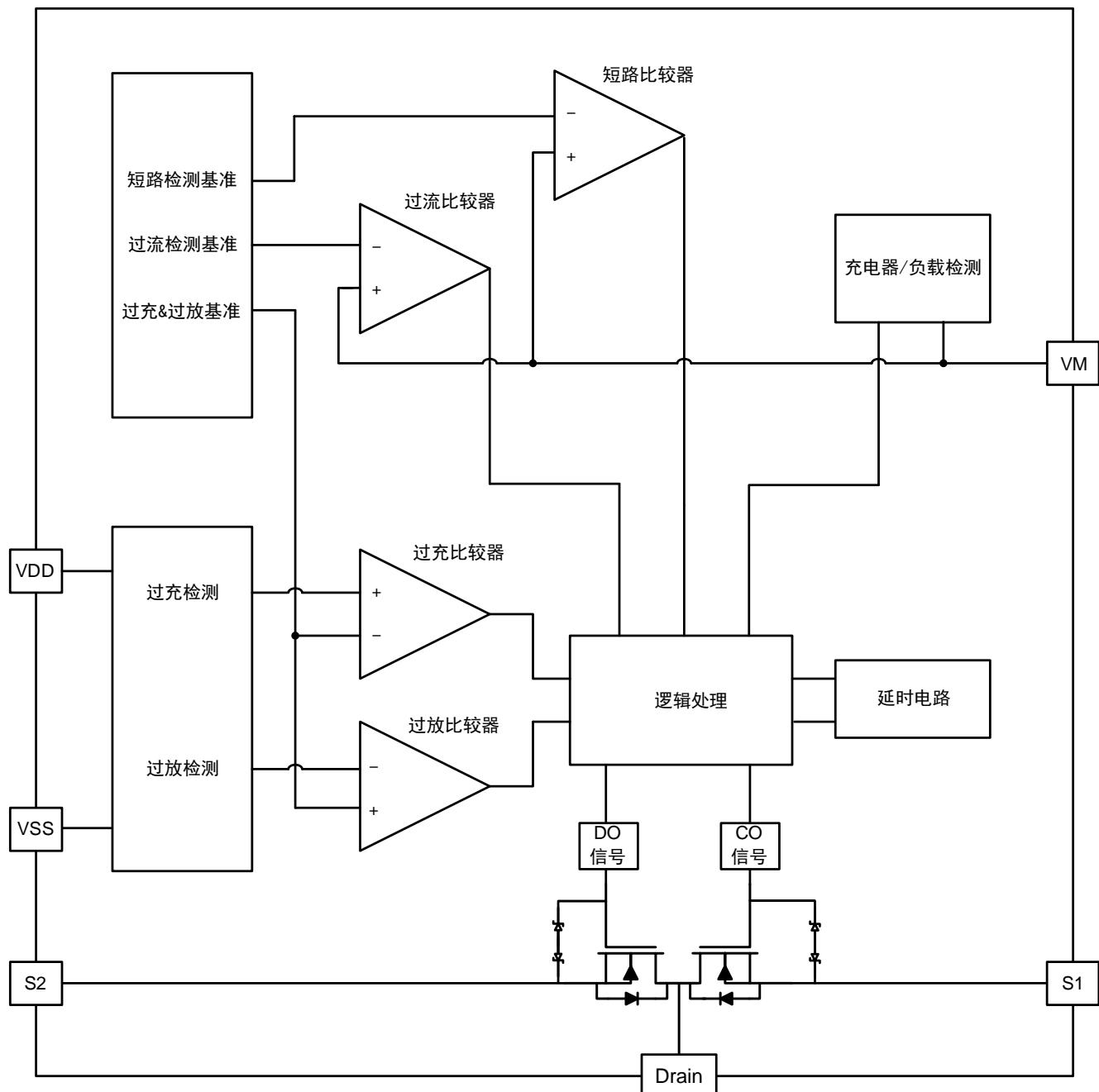


图 1

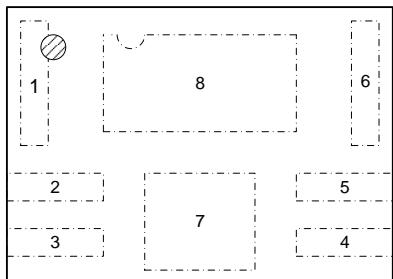
■ 引脚排列图

图 2 顶视图

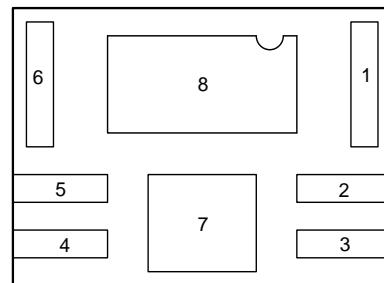
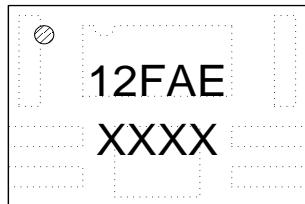


图 3 底视图

| 引脚号 | 符号 | 描述 |
|-----|-----|-----------------------------|
| 1 | S2 | 放电 MOSFET 源级端, 与 VSS 相连 |
| 2 | VSS | 电源接地端, 与供电电源(电池)的负极相连 |
| 3 | VDD | 电源输入端, 与供电电源(电池)的正极连接 |
| 4 | NC | 未连接 |
| 5 | VM | 充放电电流检测端, 与充电器或负载的负极连接 |
| 6 | S1 | 充电 MOSFET 源级端, 与充电器或负载的负极连接 |
| 7 | M1 | 芯片衬底连接, 须悬空 |
| 8 | D | 充放电 MOSFET 的共漏连接端 |

表 1

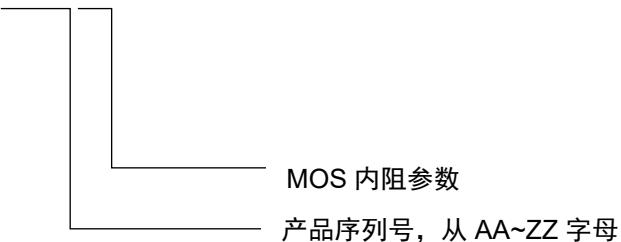
■ 产品印字

第一行：产品型号
第二行：生产批号

图 4

■ 命名规则

CM1112-FAE



■ 产品列表**1. 检测电压表**

| 产品名称 | $R_{SS(ON)}$ | 过充电 保护电压 V_{OC} | 过充电 解除电压 V_{OCR} | 过放电 保护电压 V_{OD} | 过放电 解除电压 V_{ODR} | 放电 过流 V_{EC} | 短路 保护 V_{SHORT} | 充电 过流 V_{CHA} |
|------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| CM1112-FAE | 32 mΩ | 4.425 V | 4.225 V | 2.500 V | 3.000 V | 0.150 V | 0.500 V | -0.150 V |

表 2

2. 产品功能表

| 产品名称 | 向 0V 电池 充电功能 | 放电过流状态 解除条件 | 放电过流状态解除 电压 | 过充自恢复 功能 | 休眠功能 |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|------|
| CM1112-FAE | 允许 | 断开负载 | V_{DIOV} | 有 | 无 |

表 3

3. 延迟时间

| 产品名称 | 过充电保护延时 T_{OC} | 过放电保护延时 T_{OD} | 放电过流延时 T_{EC} | 充电过流延时 T_{CHA} | 短路延时 T_{SHORT} |
|------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| CM1112-FAE | 1000 ms | 128 ms | 8 ms | 8 ms | 280 μs |

表 4

备注：需要上述规格以外的产品时，请与本公司业务部门联系。

■ 绝对最大额定值(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$)

| 项目 | 符号 | 适用端子 | 绝对最大额定值 | 单位 |
|-----------------|------------------|------|-------------------|----|
| 电源电压 | VDD | VDD | VSS-0.3 ~ VSS+8.0 | V |
| VM 端输入电压 | VM | VM | VDD-28 ~ VDD+0.3 | V |
| Gate-Source 耐压 | V _{GS} | GS | ± 12 | V |
| Drain-Source 耐压 | V _{DS} | DS | 15 | V |
| 工作环境温度 | T _{OPR} | - | -40 ~ +85 | °C |
| 保存温度范围 | T _{STG} | - | -55 ~ +125 | °C |

表 5

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = +25^\circ\text{C}$)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| [功耗] | | | | | | |
| 正常工作电流 | I_{OPE} | $VDD=3.5\text{V}, V_{VM}=0\text{V}$ | - | 1.5 | 2.1 | μA |
| 过放电流 | I_{OPED} | $VDD=V_{VM}=1.5\text{V}$ | - | 0.5 | 1.0 | μA |
| [检测电压] | | | | | | |
| 过充电保护电压 | V_{OC} | $VDD=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$ | 4.400 | 4.425 | 4.450 | V |
| 过充电解除电压 | V_{OCR} | $VDD=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$ | 4.180 | 4.225 | 4.270 | V |
| 过放电保护电压 | V_{OD} | $VDD=3.5 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 2.450 | 2.500 | 2.550 | V |
| 过放电解除电压 | V_{ODR} | $VDD=1.5 \rightarrow 3.5\text{V}$ | 2.900 | 3.000 | 3.100 | V |
| 放电过流保护电压 | V_{EC} | $VM-VSS=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 0.140 | 0.150 | 0.160 | V |
| 短路保护电压 | V_{SHORT} | $VM - VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 0.440 | 0.500 | 0.560 | V |
| 充电过流保护电压 | V_{CHA} | $VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | -0.160 | -0.150 | -0.140 | V |
| 放电过流解除电压 | V_{DIOV} | - | - | 0.150 | - | V |
| [延迟时间] | | | | | | |
| 过充电保护延时 | T_{OC} | $VDD=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$ | 700 | 1000 | 1300 | ms |
| 过放电保护延时 | T_{OD} | $VDD=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$ | 90 | 128 | 166 | ms |
| 放电过流保护延时 | T_{EC} | $VM-VSS=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 6 | 8 | 10 | ms |
| 充电过流保护延时 | T_{CHA} | $VSS-VM=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 6 | 8 | 10 | ms |
| 短路保护延时 | T_{SHORT} | $VM - VSS=0 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 140 | 280 | 504 | μs |
| [向 0V 电池充电的功能] | | | | | | |
| 充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能) | V_{OCH} | 允许向 0V 电池充电功能 | 0 | 0.7 | 1.5 | V |

表 6

■ 电气特性

(除特殊注明以外: $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ *¹)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----------------------------|--------------------|---|--------|--------|--------|---------------|
| [功耗] | | | | | | |
| 正常工作电流 | I_{OPE} | $V_{\text{DD}}=3.5\text{V}, V_{\text{VM}}=0\text{V}$ | - | 1.5 | 4.0 | μA |
| 过放电流 | I_{OPED} | $V_{\text{DD}}=V_{\text{VM}}=1.5\text{V}$ | - | 0.5 | 1.5 | μA |
| [检测电压] | | | | | | |
| 过充电保护电压 | V_{OC} | $V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$ | 4.375 | 4.425 | 4.475 | V |
| 过充电解除电压 | V_{OCR} | $V_{\text{DD}}=4.8 \rightarrow 3.5\text{V}$ | 4.135 | 4.225 | 4.315 | V |
| 过放电保护电压 | V_{OD} | $V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 2.400 | 2.500 | 2.600 | V |
| 过放电解除电压 | V_{ODR} | $V_{\text{DD}}=1.5 \rightarrow 3.5\text{V}$ | 2.800 | 3.000 | 3.200 | V |
| 放电过流保护电压 | V_{EC} | $V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 0.130 | 0.150 | 0.170 | V |
| 短路保护电压 | V_{SHORT} | $V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 0.380 | 0.500 | 0.620 | V |
| 充电过流保护电压 | V_{CHA} | $V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | -0.165 | -0.150 | -0.135 | V |
| 放电过流解除电压 | V_{DIOV} | - | - | 0.150 | - | V |
| [延迟时间] | | | | | | |
| 过充电保护延时 | T_{OC} | $V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 4.8\text{V}$ | 550 | 1000 | 2000 | ms |
| 过放电保护延时 | T_{OD} | $V_{\text{DD}}=3.5 \rightarrow 2.0\text{V}$ | 70 | 128 | 256 | ms |
| 放电过流保护延时 | T_{EC} | $V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 4 | 8 | 16 | ms |
| 充电过流保护延时 | T_{CHA} | $V_{\text{SS}}-V_{\text{M}}=0 \rightarrow 0.30\text{V}$ | 4 | 8 | 16 | ms |
| 短路保护延时 | T_{SHORT} | $V_{\text{M}}-V_{\text{SS}}=0 \rightarrow 1.5\text{V}$ | 120 | 280 | 560 | μs |
| [向 0V 电池充电的功能] | | | | | | |
| 充电器起始电压 (允许向 0V 电池充电功能) | V_{OCH} | 允许向 0V 电池充电功能 | 0 | 0.7 | 1.8 | V |

表 7

*1. 并没有在高温以及低温的条件下进行筛选，因此只保证在此温度范围下的设计规格。

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ C$, $V_{SS} = 0V$)

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------|
| 漏源漏电流 | I_{DSS} | | | 1 | uA | $V_{DS}=12V$ |
| 源源导通内阻 1 | $R_{SS(on)1}$ | 23 | 35 | 47 | $m\Omega$ | $VDD=3.0V$, $ID=1.0A$ |
| 源源导通内阻 2 | $R_{SS(on)2}$ | 22 | 32 | 42 | $m\Omega$ | $VDD=3.8V$, $ID=1.0A$ |
| 源源导通内阻 3 | $R_{SS(on)3}$ | 21 | 31 | 41 | $m\Omega$ | $VDD=4.2V$, $ID=1.0A$ |
| 源漏二极管正向导通电压 | V_{SD} | 0.4 | 0.7 | 1.2 | V | $I_S=1.0A$, $V_{GS}=0V$ |

表 8

(除特殊注明以外: $T_a = +25^\circ C$, $V_{SS} = 0V$)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 放电过流电流值 | I_{EC1} | $VDD=3.0V$ | 3.0 | 4.3 | 7.0 | A |
| | I_{EC2} | $VDD=3.8V$ | 3.3 | 4.7 | 7.3 | A |
| | I_{EC3} | $VDD=4.2V$ | 3.4 | 4.8 | 7.6 | A |
| 充电过流电流值 | I_{CHA1} | $VDD=3.0V$ | 3.0 | 4.3 | 7.0 | A |
| | I_{CHA2} | $VDD=3.8V$ | 3.3 | 4.7 | 7.3 | A |
| | I_{CHA3} | $VDD=4.2V$ | 3.4 | 4.8 | 7.6 | A |

表 9

(除特殊注明以外: $T_a = -20^\circ C$, $V_{SS} = 0V$)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 放电过流电流值 | I_{EC1} | $VDD=3.0V$ | 3.6 | 4.9 | 7.9 | A |
| | I_{EC2} | $VDD=3.8V$ | 3.9 | 5.3 | 8.2 | A |
| | I_{EC3} | $VDD=4.2V$ | 4.0 | 5.7 | 8.8 | A |
| 充电过流电流值 | I_{CHA1} | $VDD=3.0V$ | 3.6 | 4.9 | 7.9 | A |
| | I_{CHA2} | $VDD=3.8V$ | 3.9 | 5.3 | 8.5 | A |
| | I_{CHA3} | $VDD=4.2V$ | 4.0 | 5.7 | 9.2 | A |

表 10

(除特殊注明以外: $T_a = +60^\circ C$, $V_{SS} = 0V$)

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 放电过流电流值 | I_{EC1} | $VDD=3.0V$ | 2.7 | 4.0 | 6.4 | A |
| | I_{EC2} | $VDD=3.8V$ | 3.0 | 4.4 | 6.7 | A |
| | I_{EC3} | $VDD=4.2V$ | 3.1 | 4.2 | 7.0 | A |
| 充电过流电流值 | I_{CHA1} | $VDD=3.0V$ | 2.7 | 4.0 | 7.0 | A |
| | I_{CHA2} | $VDD=3.8V$ | 3.0 | 4.1 | 6.7 | A |
| | I_{CHA3} | $VDD=4.2V$ | 3.1 | 4.2 | 7.4 | A |

表 11

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VDD与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压（ V_{OD} ）以上并在过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，且VM端子电压在充电过流保护电压（ V_{CHA} ）以上并在放电过流保护电压（ V_{EC} ）以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，就能恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VDD与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压（ V_{OC} ），并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间(T_{OC})时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除，CO端子输出电压由低电平变为高电平，使充电控制用MOSFET导通。

- 1) $VM < V_{EC}$ ，电池电压降低到过充解除电压（ V_{OCR} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) 移开充电器并连接负载（ $VM > V_{EC}$ ），当电池电压降低到过充电保护电压（ V_{OC} ）以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

3. 过放电状态

在过放电状态下，如果VDD端子-VM端子间的电压差降低到0.1V(典型值)以下，消耗电流将减少至过放时的消耗电流(I_{OPED})，在过放电状态下，有以下三种方法解除：

- 1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V$ (典型值)，当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- 2) 连接充电器，若 $0V$ (典型值) $< VM < 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 3) 不连接充电器， $VM \geq 0.7V$ (典型值)，当电池电压高于过放解除电压（ V_{ODR} ）时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子电压持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{DIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{DIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流保护

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果 VM 端子电压低于充电过流保护电压(V_{CHA})，并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间(T_{CHA})，则关闭充电控制用的 MOSFET，停止充电，这个状态称为充电过流状态。进入充电过流检测状态后，如果断开充电器使 VM 端子电压高于充电过流保护电压(V_{CHA})时，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向 0V 电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到 0V 的电池进行再充电。当连接在电池正极(P+)和电池负极(P-)之间的充电器电压，高于向 0V 电池充电的充电器起始电压(V_{OCH})时，充电控制用 MOSFET 的门极固定为 VDD 端子的电位，由于充电器电压使 MOSFET 的门极和源极之间的电压差高于其导通电压，充电控制用 MOSFET 导通(CO 端子打开)，开始充电。这时，放电控制 MOSFET 仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，IC 进入正常工作状态。

注意：请询问电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0 V电池充电。

■ 应用电路

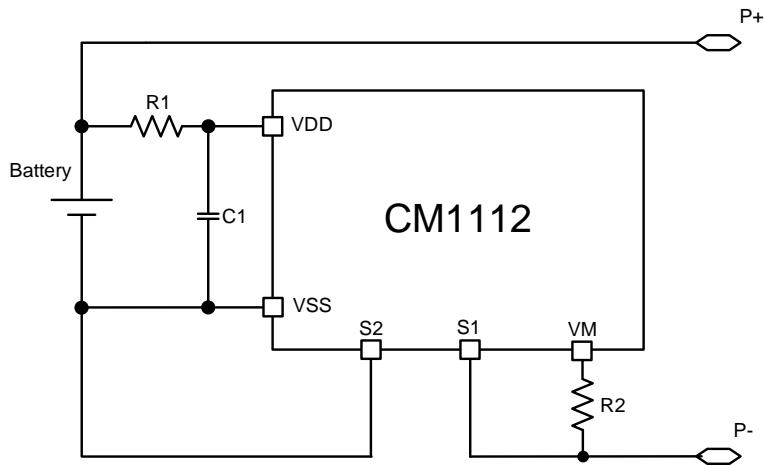


图 5

| 器件标识 | 典型值 | 参数范围 | 单位 |
|------|-----|------------|----|
| R1 | 470 | 470 ~ 1500 | Ω |
| R2 | 2 | 1 ~ 3 | kΩ |
| C1 | 0.1 | ≥ 0.1 | μF |

表 12

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

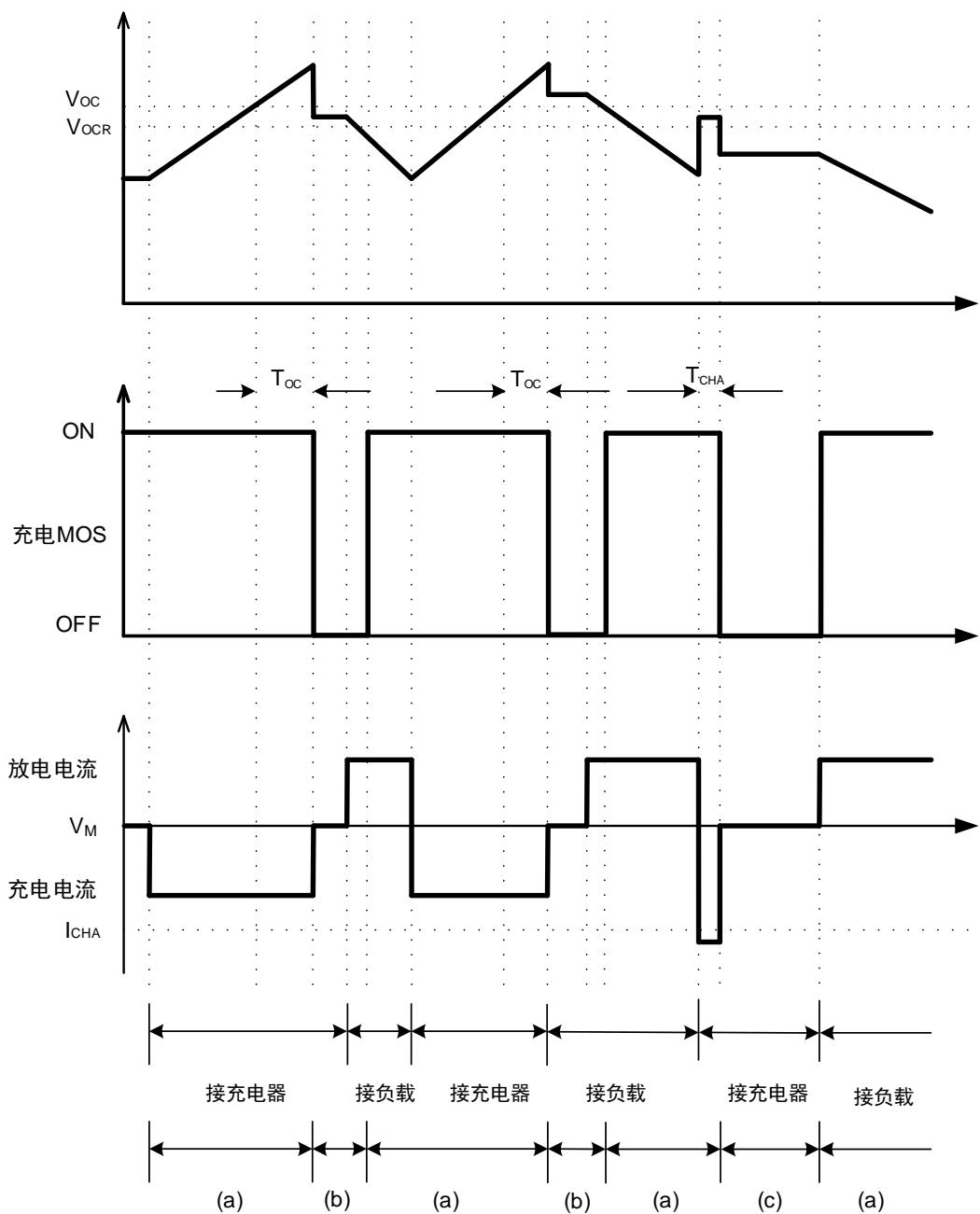


图 6

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

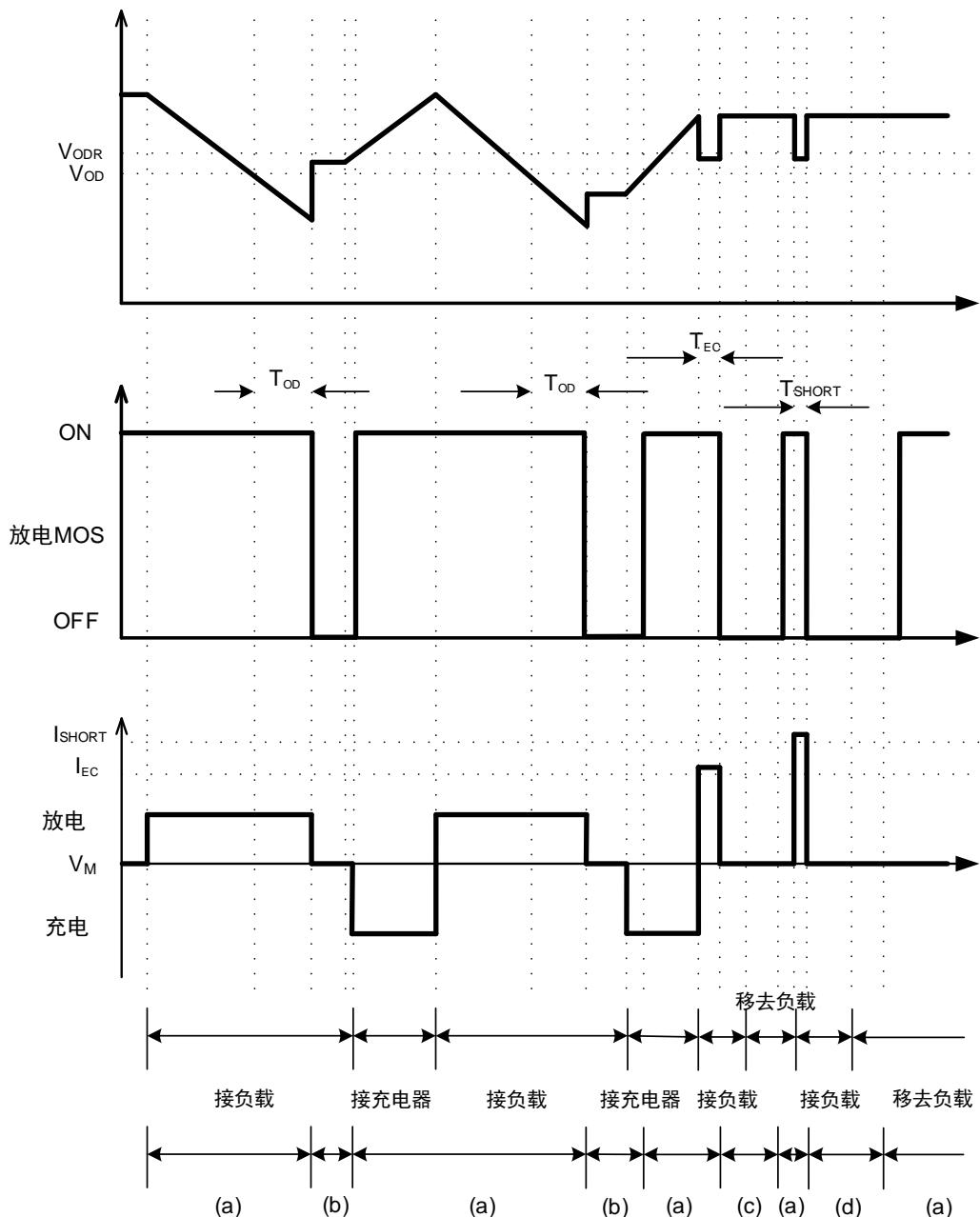


图 7

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态

■ 测试电路

1. 过充电检测电压、过充电解除电压（测试电路 1）

在 $V1=3.5V$, $V2=10mV$ 设置后的状态下，逐渐升高 $V1$ 并且保持时间超过过充电检测延时，当 V_{S1} 的电压由低电平变为大约一个二极管的导通阈值时，充电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电检测电压 (V_{OC})。过充保护后，逐渐降低 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由一个二极管的导通阈值变为低电平时，充电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过充电解除电压 (V_{OCR})。

2. 过放电检测电压、过放电解除电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=10mV$ 设置后的状态下，逐渐降低 $V1$ 并且保持时间超过过放电检测延时， V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电检测电压 (V_{OD})。过放电保护后，逐渐升高 $V1$ ，当 V_{S1} 的电压由 $V1$ 变为低电平时，放电 MOS 管开启，对应的 $VDD-VSS$ 之间的电压即为过放电解除电压 (V_{ODR})。

3. 放电过流检测电压、短路检测电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）升高并保持时间超过放电过流检测延时(T_{EC})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为放电过流检测电压(V_{EC})。

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）升高并保持时间超过短路保护延时(T_{SHORT})，当 V_{S1} 由低电平变为 $V1$ 时，放电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为短路保护电压(V_{SHORT})。

4. 充电过流检测电压（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 在瞬间（ $10\mu s$ 内）降低并保持时间超过充电过流检测延时(T_{CHA})，当 V_{S1} 由低电平变为 $0.5V$ 左右（充电管体二极管电压），充电 MOS 管关断，对应的 $VM-VSS$ 的电压即为充电过流检测电压(V_{CHA})。

5. 允许向 0V 电池充电的充电器起始电压 ("允许"向 0V 电池充电的功能)（测试电路 5）

在 $V1=0V$, $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 缓慢降低，当 $S1$ 端子出现大于 $10 \mu A$ 的充电电流时，所对应的 $V2$ 电压即是允许向 $0V$ 电池充电的充电器起始电压 (V_{OCH})。

6. 工作时消耗电流、过放时消耗电流（测试电路 2）

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，流过 VDD 端的电流 I_{DD} 即为工作时消耗电流(I_{OPE})。

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，然后将 $V1$ 由 $3.5V$ 调整到 $1.5V$ ，进入过放电状态后将 VM 端悬空，此时流过 VDD 端的电流 I_{DD} 即为过放时消耗电流(I_{OPED})。

7. 过充电检测延时、过放电检测延时（测试电路 3）

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压上升到 V_{OC} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为一个二极管的阈值，这段时间即为过充电检测延时 T_{OC} 。

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V1$ 的电压下降到 V_{OD} 或以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为过放电检测延时 T_{OD} 。

8. 放电过流检测延时、短路保护延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 的电压瞬间（10us 内）上升到 V_{EC} 或以上，且 V_{SHORT} 以下并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为放电过流检测延时 T_{EC} 。

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 的电压瞬间（10us 内）上升到 V_{SHORT} 或以上并维持一段时间后， V_{S1} 的值由低电平变为 $V1$ ，这段时间即为短路保护延时 T_{SHORT} 。

9. 充电过流检测延时（测试电路 4）

在 $V1=3.5V$ 、 $V2=0V$ 设置后的状态下，将 $V2$ 的电压瞬间（10μs 内）降低到 V_{CHA} 或以下并维持一段时间后， V_{S1} 由低电平变为 0.5V 左右（充电管体二极管电压），充电 MOS 管关断，这段时间即为充电过流检测延时 T_{CHA} 。

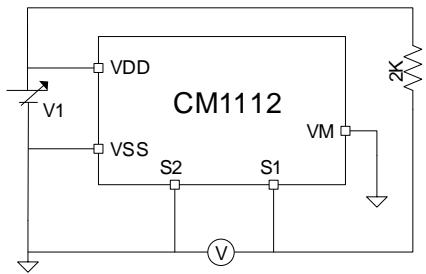


图 8 测试电路 1

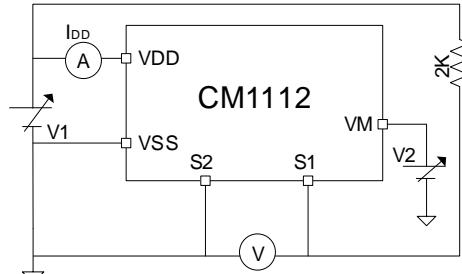


图 9 测试电路 2

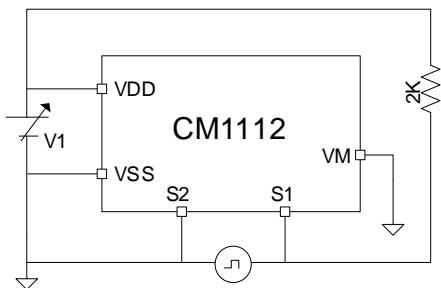


图 10 测试电路 3

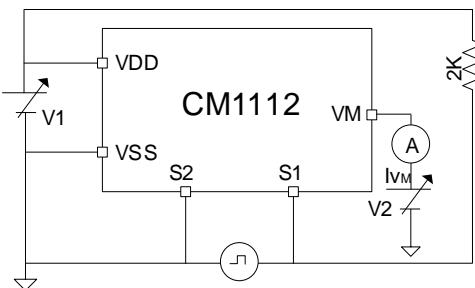


图 11 测试电路 4

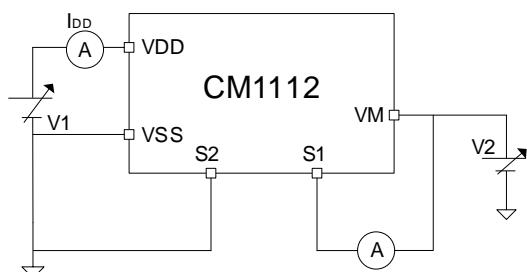


图 12 测试电路 5

■ 封装信息

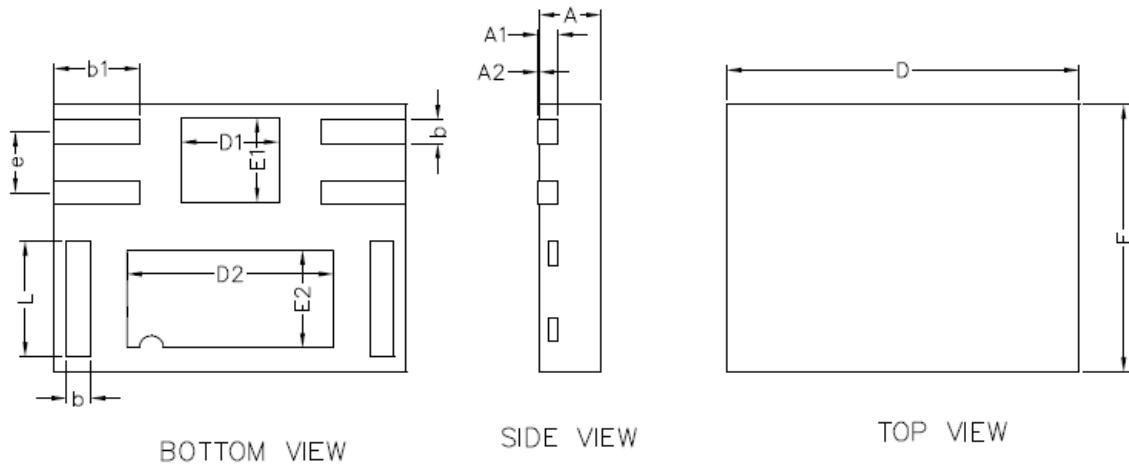


图 13

| 2.2*2.9-6L-0.50mm | | | | |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|
| symbol | dimensions | MIN(mm) | NOM(mm) | MAX(mm) |
| A | | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| A2 | | 0.00 | | 0.05 |
| A1 | | 0.15 | REF | |
| D | | 2.85 | 2.90 | 2.95 |
| E | | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| D1 | | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| E1 | | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| b | | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| e | | 0.50 | BSC | |
| L | | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| b1 | | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| D2 | | 1.65 | 1.70 | 1.75 |
| E2 | | 0.75 | 0.80 | 0.85 |

表 13

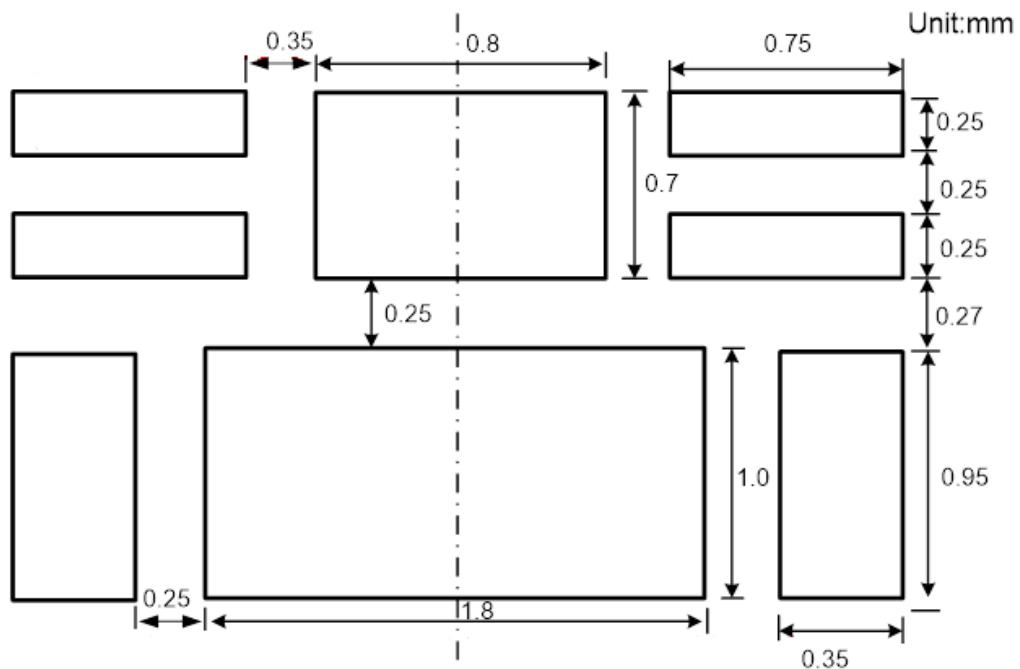
■ PCB Layout

图 14

注意：1.请勿在塑封体下印刷丝网、焊锡，避免产品被顶起。

2.钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘对齐。

3.请向引脚的前端方向扩展焊盘模式。

4.请勿向封装中间的范围内扩大焊盘模式。

■ 载带信息

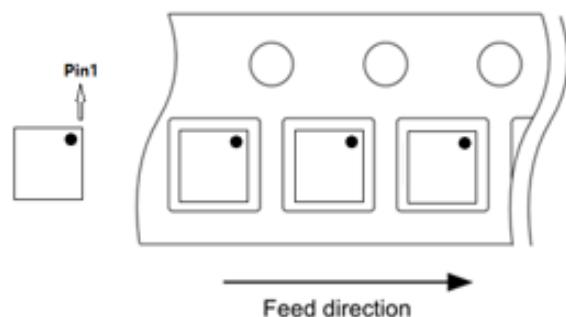
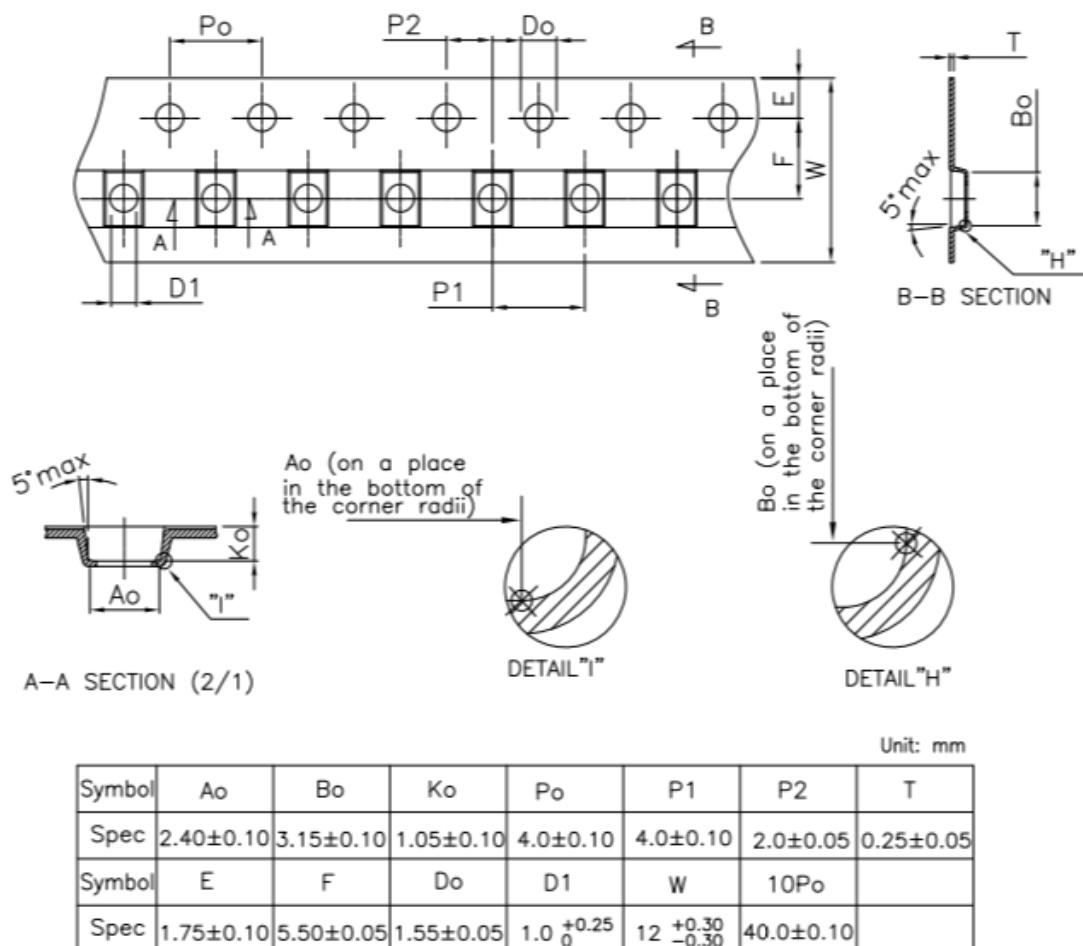
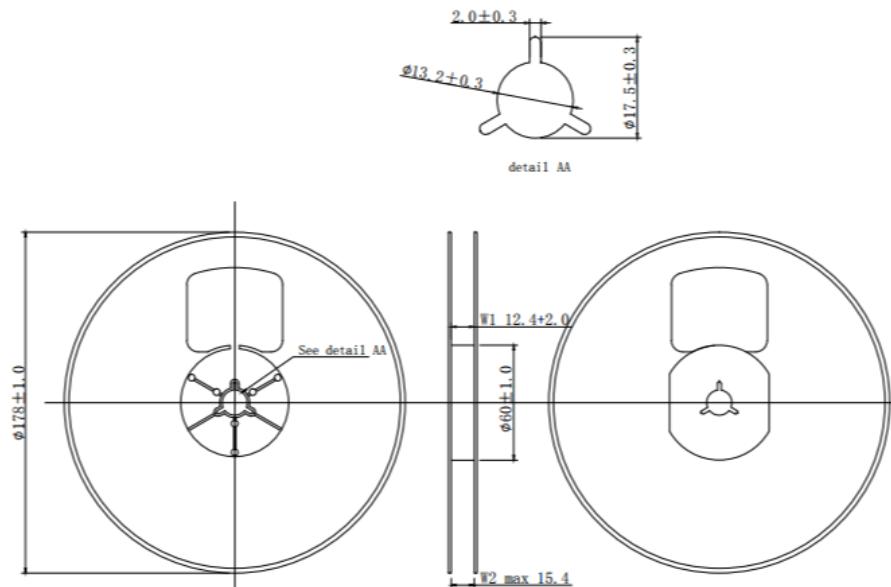


图 15

■ 卷盘信息**图 16****■ 包装信息**

| 卷盘 | 颗/盘 | 盘/盒 | 盒/箱 |
|----|------|-----|-----|
| 7" | 3000 | 10 | 4 |

使用注意事项

1. 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。需要更详细的内容，请与本公司市场部门联系。
2. 本规格书中的电路示例、使用方法等仅供参考，并非保证批量生产的设计，因第三方所有权引发的问题，本公司对此概不承担任何责任。
3. 本规格书在单独应用的情况下，本公司保证它的性能、典型应用和功能符合说明书中的条件。当使用客户的产品或设备时，以上条件我们不作保证，建议客户做充分的评估和测试。
4. 请注意在规格书记载的条件范围内使用产品，请特别注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。对于客户在超出规格书中规定额定值使用产品，即使是瞬间的使用，由此造成的损失，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本规格书中的产品，未经书面许可，不可用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的高可靠性电路中，例如：医疗器械、防灾器械、车辆器械、车载器械、航空器械、太空器械、核能器械等，亦不得作为其部件使用。
本公司指定用途以外使用本规格书记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
7. 本公司一直致力于提高产品的质量及可靠性，但所有的半导体产品都有一定的概率发生失效。
为了防止因本产品的概率性失效而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户对整个系统进行充分的评价，自行负责进行冗余设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计，可以避免事故的发生。
8. 本产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。另外，封装和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
9. 废弃本产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
10. 本规格书中内容，未经本公司许可，严禁用于其它目的的转载或复制。